

概述

HM8247 是一款专为保护 4~7 串锂离子/聚合物电池、磷酸铁锂电池或钛酸锂电池的电池保护芯片，可降低因电池过充，过放，过温和/或过流条件而导致的电池损坏或寿命缩短的风险。

$\pm 25mV$ 的过充电检测电压精度保证电池安全的全容量充电。 $\pm 10mV$ 的电流检测电压精度保证放电过流准确触发。

HM8247 的充电过温保护阈值和放电过温保护阈值可通过外部电阻独立设置。

HM8247 可以直接驱动外部 N 型的充电 MOSFET 和 N 型放电 MOSFET。

HM8247 的低功耗设计让电池包在存储阶段只消耗微不足道的电流。

应用

- 电动滑板车
- 电动工具
- 家电
- 备用电池系统

特点

- 内置高精度电压检测电路：

➤ 过充电检测电压：

$$V_{COV} = 2.80V/3.80V/4.25V$$

精度： $\pm 25mV$

➤ 过充电恢复电压：

$$V_{COVR} = 2.50V/3.60V/4.05V$$

➤ 过放电检测电压：

$$V_{CUV} = 1.5V/2.0V/2.3V/2.7V$$

精度： $\pm 80mV$

➤ 过放电恢复电压：

$$V_{CUVR} = 1.7V/2.3V/3.0V$$

- 内置三段放电过电流检测电路：

➤ 过电流 1 检测电压：

$$V_{PDOC1} = 50mV \text{ to } 150mV; 25mV/\text{step}$$

精度： $\pm 10mV$

➤ 过电流 2 检测电压：

$$V_{PDOC2} = 2 * V_{PDOC1}$$

精度： $\pm 20mV$

➤ 负载短路检测电压：

$$V_{PSC} = 5 * V_{PDOC1}$$

精度： $\pm 50mV$

- 内置独立的充电过温和放电过温保护，可通过外部电阻独立设置充电过温保护阈值和放电过温保护阈值

- 内置充电低温保护

- 各种延迟时间可通过外部电容设置

- 低消耗电流：

➤ 工作状态时：VCC 典型值 $25\mu A$

➤ 休眠状态时： $< 1\mu A$

- 封装：SSOP-20

订购信息

封装	温度范围	订购型号	包装打印	产品打印
SSOP-20	-40°C~85°C	HM8247-YYY	Tape and Reel 2500 units	HM8247-YYY xxxx

Note: ZZZZ: NqvP wo dgt

典型应用电路

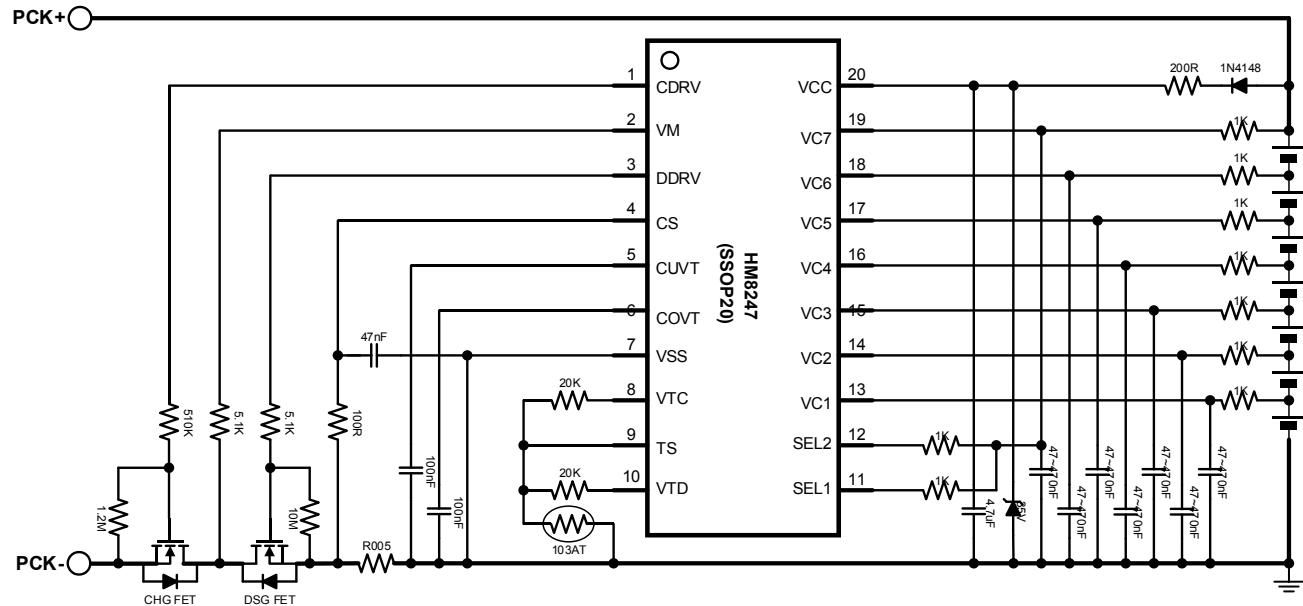


图 1.7 串电池的典型应用电路

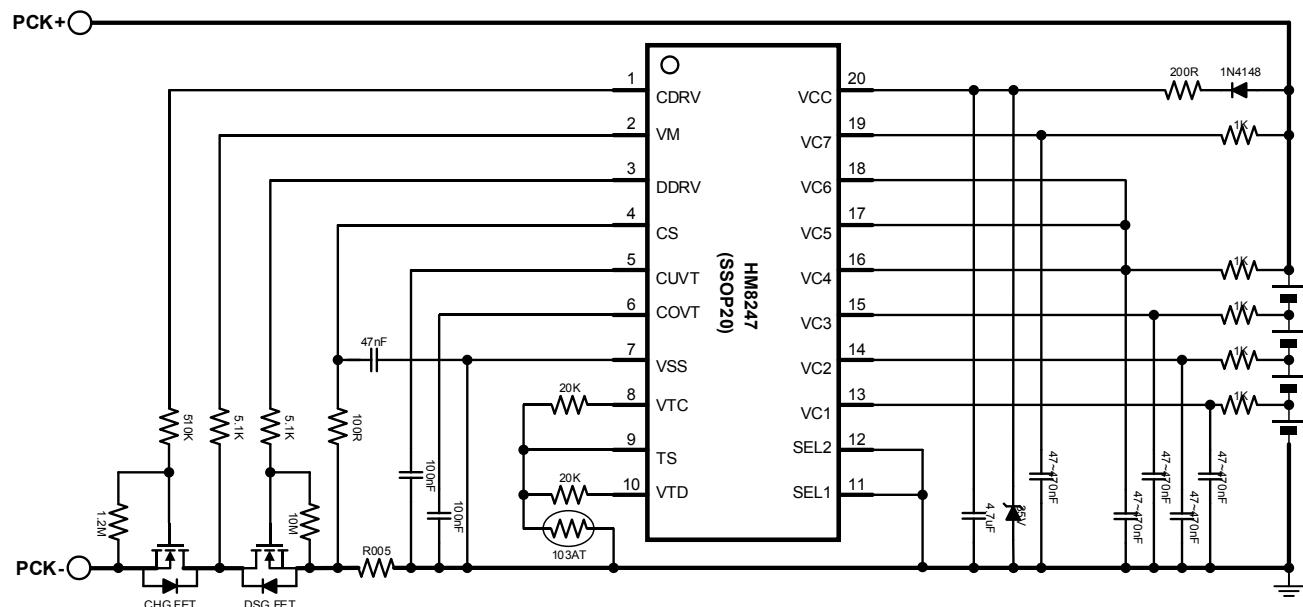


图 2.4 串电池的典型应用电路

管脚定义图

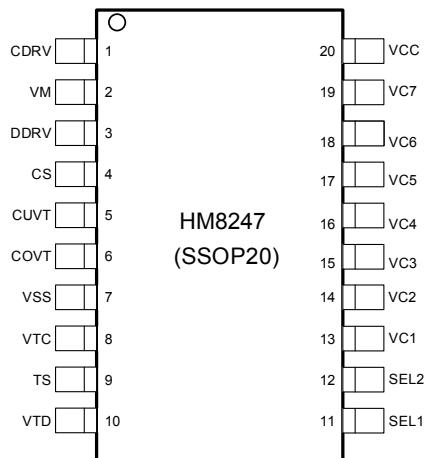


图 3. 管脚定义图

管脚描述

引脚号码	引脚名称	引脚功能描述															
1	CDRV	充电 NMOSFET 驱动															
2	VM	负载开路检测和充电器检测引脚															
3	DDRV	放电 NMOSFET 驱动															
4	CS	电流检测电压输入引脚															
5	CUVT	电池欠压保护延迟时间设定引脚, 外接电容															
6	COVT	电池过压保护延迟时间设定引脚, 外接电容															
7	VSS	芯片负电源输入引脚															
8	VTC	充电过温保护阈值和充电低温保护阈值设定引脚															
9	TS	温度检测电压输入引脚															
10	VTD	放电过温保护阈值设定引脚															
11	SEL1	4 串、5 串、6 串、7 串应用设置: <table border="1"> <tr> <th>SEL2</th> <th>SEL1</th> <th>Configuration</th> </tr> <tr> <td>VC7</td> <td>VC7</td> <td>7 Cells</td> </tr> <tr> <td>VC7</td> <td>VSS</td> <td>6 Cells</td> </tr> <tr> <td>VSS</td> <td>VC7</td> <td>5 Cells</td> </tr> <tr> <td>VSS</td> <td>VSS</td> <td>4 Cells</td> </tr> </table>	SEL2	SEL1	Configuration	VC7	VC7	7 Cells	VC7	VSS	6 Cells	VSS	VC7	5 Cells	VSS	VSS	4 Cells
SEL2	SEL1	Configuration															
VC7	VC7	7 Cells															
VC7	VSS	6 Cells															
VSS	VC7	5 Cells															
VSS	VSS	4 Cells															
12	SEL2																
13	VC1	电芯 1 正极输入, 电芯 2 负极输入															
14	VC2	电芯 2 正极输入, 电芯 3 负极输入															
15	VC3	电芯 3 正极输入, 电芯 4 负极输入															
16	VC4	电芯 4 正极输入, 电芯 5 负极输入															
17	VC5	电芯 5 正极输入, 电芯 6 负极输入															
18	VC6	电芯 6 正极输入, 电芯 7 负极输入															
19	VC7	电芯 7 正极输入															
20	VCC	芯片正电源输入引脚, 连接电池组正端															

简化模块图

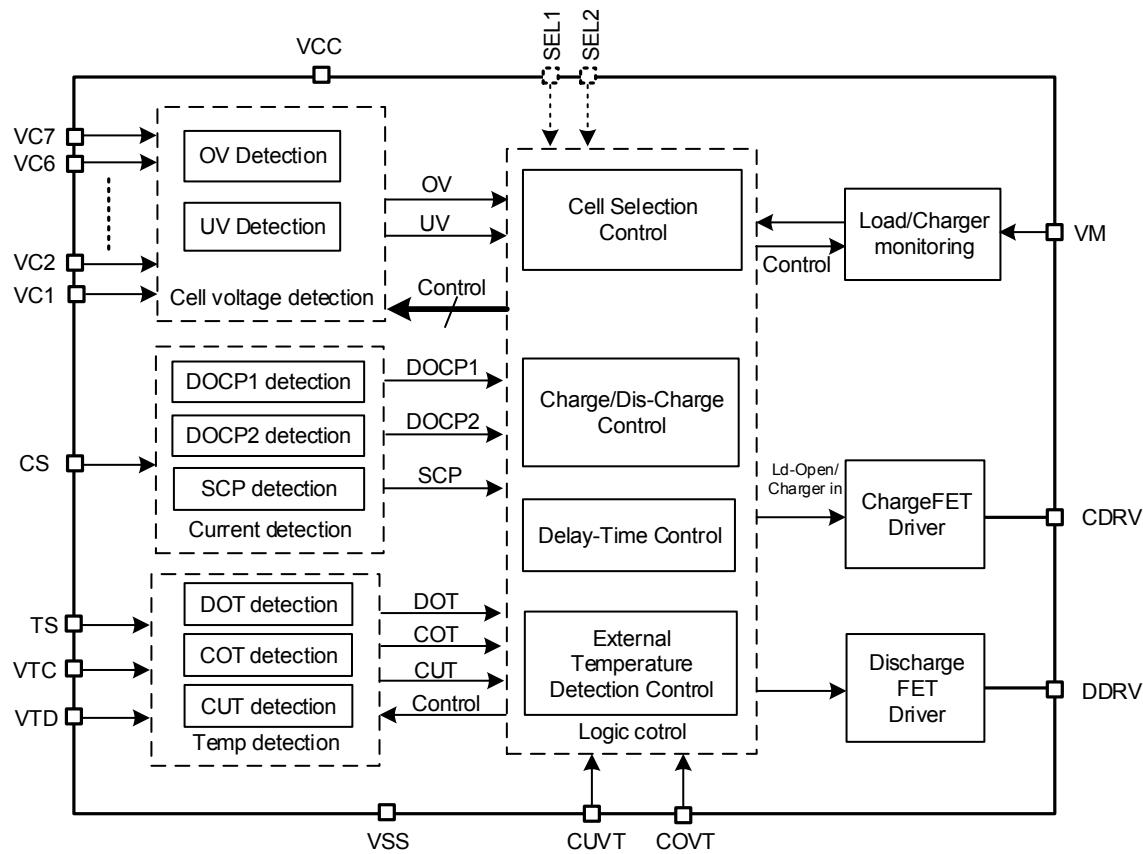


图 4. 内部模块简化图

极限参数(注 1)

(无特别说明, $T_a=25^{\circ}\text{C}$)

参数	符号	对应引脚	参数范围	单位
VCC引脚输入电压范围	V_{CC}	V_{CC}	$V_{\text{SS}}-0.3 \text{ to } V_{\text{SS}}+35$	V
低压引脚电压范围	$V_{\text{IN_LV}}$	CS, CUVT, COVT, TS, VTD, VTC	$V_{\text{SS}}-0.3 \text{ to } V_{\text{SS}}+5.5$	V
VM 引脚电压范围	V_{VM}	VM	$V_{\text{SS}}-0.3 \text{ to } V_{\text{CC}}+0.3$	V
电池输入引脚电压范围 $VC(n) \text{ to } VC(n-1), n=2 \text{ to } 7;$ $VC1 \text{ to } VSS$	V_{CELL}	$(VC7, VC6), (VC6, VC5),$ $(VC5, VC4), (VC4, VC3),$ $(VC3, VC2), (VC2,$ $VC1), (VC1, VSS)$	-0.3 to +8	V
电池输入引脚电压范围 $VC(n), n=1 \text{ to } 7;$	$VC(n)$	$VC(n)$	$V_{\text{SS}}-0.3 \text{ to } V_{\text{SS}}+35$	V
CDRV 引脚电压范围	V_{CDRV}	CDRV	$V_{\text{CC}}-35 \text{ to } V_{\text{CC}}+0.3$	V
DDRV 引脚电压范围	V_{DDRV}	DDRV	$V_{\text{SS}}-0.3 \text{ to } V_{\text{SS}}+15$	V
ESD (HBM) (注 2)			± 2	kV
工作结温范围	T_A		-40 to +85	$^{\circ}\text{C}$
存储温度范围	T_{STG}		-40 to +125	$^{\circ}\text{C}$
PN 结到环境热阻(SSOP-20)	θ_{JA}		130	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$

注 1: 最大极限值是指超出该工作范围

注 2: HBM: ANSI/ESDA/JEDEC JS-001-2014

电气参数

(无特别说明, Ta=25°C, V_{CELL}=3.6V)

参数	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
VCC 供电						
输入电压工作范围	V _{CC}		4.0		32	V
输入电流	I _{VCC_NOR}	正常状态, V _{CELL} =3.6V, CDRV 悬空		25	45	μA
	I _{VCC_PD}	关断状态, V _{CELL} =1.8V, 无充电器		0.6	1.0	μA
启动电压	V _{POR}			4.8		V
放电 MOSFET 驱动电源	V _{VREGH}	V _{CC} >V _{VREGH} +1V	8.0	10.5	13	V
		V _{CC} <V _{VREGH} +1V		VCC-1		V
电池检测电路输入电流 (I_{VC7}, I_{VC6}, I_{VC5}, I_{VC4}, I_{VC3}, I_{VC2}, I_{VC1})						
正常状态的 VC7 输入电流	I _{VC7}	V _{CELL} =3.6V		18.0	22.0	μA
正常状态的 VC(n) 输入电流	I _{VCn}	V _{CELL} =3.6V, n=1~6	-0.5		+0.5	μA
电压保护参数						
过充电保护电压: 2.80V/3.80V/4.25V 可选;	V _{Cov}		V _{Cov-25}	V _{Cov}	V _{Cov+25}	mV
过充电恢复电压: V _{CovR} =V _{Cov} -V _{ΔCov} ; V _{CovR} : 2.50V/3.60V/4.05V 可选;	V _{CovR}		V _{CovR-25}	V _{CovR}	V _{CovR+25}	mV
过放电保护电压: 1.5V/2.0V/2.3V/2.7V 可选;	V _{Cuv}		V _{Cuv-80}	V _{Cuv}	V _{Cuv+80}	mV
过放电恢复电压: V _{CuVR} =V _{Cuv} +V _{ΔCuv} ; V _{CuVR} : 1.7V/2.3V/3.0V 可选;	V _{CuVR}		V _{CuVR-80}	V _{CuVR}	V _{CuVR+80}	mV
电流保护参数						
过电流 1 保护电压: 50mV~150mV 可选; 25mV/step	V _{PDOC1}		V _{PDOC1-10}	V _{PDOC1}	V _{PDOC1+10}	mV
过电流 2 保护电压: V _{PDOC2} =2*V _{PDOC1}	V _{PDOC2}		V _{PDOC2-20}	V _{PDOC2}	V _{PDOC2+20}	mV
负载短路保护电压 V _{PSC} =5*V _{PDOC1}	V _{PSC}		V _{PSC-50}	V _{PSC}	V _{PSC+50}	mV
温度保护参数						
放电过温保护阈值	t _{DOT}	由连接到 VTD 引脚的电阻设定	t _{DOT-5}	t _{DOT}	t _{DOT+5}	°C
放电过温恢复迟滞	t _{ΔDOT}			10		°C
放电过温恢复阈值	t _{DOTR}	t _{DOTR} = t _{DOT} - t _{ΔDOT}	t _{DOTR-5}	t _{DOTR}	t _{DOTR+5}	°C
充电过温保护阈值	t _{COT}	由连接到 VTC 引脚的电阻设定	t _{COT-5}	t _{COT}	t _{COT+5}	°C
充电过温恢复迟滞	t _{ΔCOT}			5		°C
充电过温恢复阈值	t _{COTR}	t _{COTR} = t _{COT} - t _{ΔCOT}	t _{COTR-5}	t _{COTR}	t _{COTR+5}	°C
充电低温保护阈值	t _{CUT}	由连接到 VTC 引脚的电阻设定	t _{CUT-5}	t _{CUT}	t _{CUT+5}	°C
充电低温恢复迟滞	t _{ΔCUT}			5		°C
充电低温恢复阈值	t _{CUTR}	t _{CUTR} = t _{CUT} + t _{ΔCUT}	t _{CUTR-5}	t _{CUTR}	t _{CUTR+5}	°C
充放电状态检测电压	V _{DSG}		2.0	3.5	6.5	mV
检测延迟时间						
过充电保护延迟时间	T _{Cov}	C _{CovT} =100nF	0.6	1.0	1.4	s
过放电保护延迟时间	T _{Cuv}	C _{CuVT} =100nF	0.6	1.0	1.4	s
过放电后芯片进入休眠延迟时间	T _{CUV_PD}	C _{CuVT} =100nF		11		s
过电流 1 保护延迟时间	T _{PDOC1}	C _{CuVT} =100nF	0.6	1.0	1.4	s
过电流 2 保护延迟时间	T _{PDOC2}	C _{CuVT} =100nF	0.06	0.1	0.14	s
负载短路保护延迟时间	T _{PSC}	内部固定延迟	100	250	500	μs

温度检测周期	T_{TDET}	$C_{COVT}=100nF$	0.5	1.0	1.5	S
SEL1, SEL2						
SEL1, SEL2 引脚逻辑高电平阈值	V_{SELH}	SEL1, SEL2	$V_{CC}-2.5$			V
SEL1, SEL2 引脚逻辑低电平阈值	V_{SELL}	SEL1, SEL2			1.5	
MOSFET 驱动参数						
CDRV 引脚输出电流能力	I_{CDRV}	$V_{CELL}=3.6V, V_{CDRV}=V_{CC}-3V$	4	6	8	μA
		充电保护事件发生		Hi-Z		
DDRV 引脚输出电压	V_{DDRV}	无放电保护事件发生	$= V_{VREGH}$			
		放电保护事件发生			0.4	V
VM						
VM 引脚吸收电流能力	I_{VM}	负载开路检测			50	μA

功能描述

1. 上电过程

当电源接入, V_{CC} 上升, 充电 MOSFET 默认打开, 放电 MOSFET 默认关闭; 当 $V_{CC} \geq V_{POR}$, HM8247 将检测是否有放电保护事件发生。如果没有放电保护事件且负载断开, DDRV 驱动放电 MOSFET 打开, HM8247 进入正常工作状态。

2. 放电过电流保护

HM8247 有三段放电过电流保护功能。

PDOC1: 当 $V_{CS} \geq V_{PDOC1}$ 且延迟时间 $T_D \geq T_{PDOC1}$, PDOC1 触发, 放电 MOSFET 关闭。

PDOC2: 当 $V_{CS} \geq V_{PDOC2}$ 且延迟时间 $T_D \geq T_{PDOC2}$, PDOC2 触发, 放电 MOSFET 关闭。

PSC: 当 $V_{CS} \geq V_{PSC}$ 且延迟时间 $T_D \geq T_{PSC}$, PSC 触发, 放电 MOSFET 关闭

PDOC1, PDOC2 和 PSC 只有在负载开路时才会解除。

3. 温度保护

在正常工作条件下, HM8247 周期性 (T_{TDET}) 轮流检测充电温度保护和放电温度保护。

放电状态

DOT: HM8247 一旦检测到电池组的温度高于放电过温保护阈值 t_{DOT} 两次, 放电过温保护 DOT 触发, 充放电 MOSFET 同时关闭。

DOT 恢复: 当以下条件发生时, 放电过温保护状态将被解除。

a) 电池组温度降低至放电过温恢复阈值 t_{DORT} 及以下。

当 DOT 恢复时, 充电 MOSFET 打开, 放电 MOSFET 打开需要满足以下条件:

a) 负载被移除或者充电器插入。

充电状态

COT: HM8247 一旦连续检测到电池组的温度高于充电过温保护阈值 t_{COT} 两次, 充电过温保护 COT 触发, 充电

MOSFET 关闭。

COT 恢复: 当以下两个条件之一发生时, 充电过温保护状态就会被解除。

- a) 电池组温度低于充电过温保护恢复阈值 t_{COTR} 及以下。
- b) 检测到放电电流。

CUT: HM8247 一旦连续检测到电池组的温度低于充电低温保护阈值 t_{CUT} 两次, 充电低温保护 CUT 触发, 充电 MOSFET 关闭。

CUT 恢复: 当以下两个条件之一发生时, 充电低温保护状态就会被解除。

- a) 电池组温度高于充电低温保护恢复阈值 t_{CUTR} 及以上。
- b) 检测到放电电流。

DOT、COT、CUT 阈值设定

图 5 是温度检测电路, 热敏电阻为 $B=3435$ 的 NTC: 103AT。

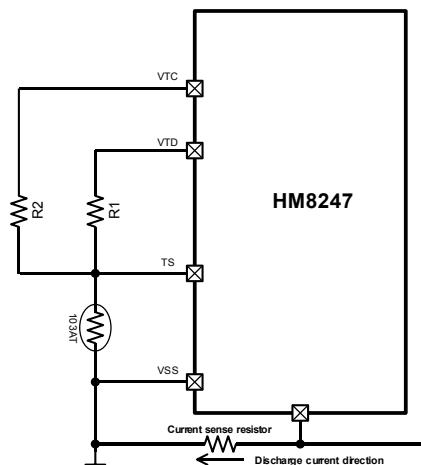


图 5. 温度检测电路

DOT 阈值设定

如图 5, DOT 阈值由连接到 VTD 的电阻 $R1$ 设定:
 $R1 = 9 * R_{DOT}$

其中, R_{DOT} 是热敏电阻 103AT 在 DOT 温度阈值所对应的阻值。

例如:

设置 DOT 阈值为 65°C, 对应的热敏电阻阻值 $R_{DOT}=2.588\text{K}\Omega$, 则 $R1=23\text{K}\Omega$ 。

设置 DOT 阈值为 70°C, 对应的热敏电阻阻值 $R_{DOT}=2.228\text{K}\Omega$, 则 $R1=20\text{K}\Omega$ 。

设置 DOT 阈值为 75°C, 对应的热敏电阻阻值 $R_{DOT}=1.924\text{K}\Omega$, 则 $R1=17\text{K}\Omega$ 。

COT/CUT 阈值设定

COT/CUT 阈值由连接到 VTC 的电阻 R2 设定:

$R2=4.75R_{COT}$

其中, R_{COT} 是热敏电阻 103AT 在 COT 温度阈值所对应的阻值。

CUT 阈值由 R_{COT} 决定:

$R_{CUT}=7.125R_{COT}$

例如:

设置 COT 阈值为 45°C, 对应的热敏电阻阻值 $R_{COT}=4.911\text{K}\Omega$, 则 $R2=23\text{K}\Omega$, $R_{CUT}=34.5\text{K}\Omega$, 对应的 CUT 阈值为 -5.5°C。

设置 COT 阈值为 50°C, 对应的热敏电阻阻值 $R_{COT}=4.16\text{K}\Omega$, 则 $R2=20\text{K}\Omega$, $R_{CUT}=30\text{K}\Omega$, 对应的 CUT 阈值为 -2°C。

COT 阈值和 DOT 阈值由外部电阻 R1 和 R2 分别设置, 可使应用更加灵活和便利。

取消 DOT/COT/CUT 功能:

用 20KΩ 的电阻替代热敏电阻将不会触发 COT、DOT 和 CUT。

仅取消 CUT 功能:

将一个 51KΩ 的电阻与热敏电阻并联将不会触发 CUT。

4. 过充电保护

一旦任何一节电池电压超过 V_{cov} 并持续 T_{cov} 及以上, HM8247 就进入过充电保护状态 (COV), 充电 MOSFET 关闭。在 COV 状态, HM8247 一旦检测到放电电流, 充电 MOSFET 打开。

当每节电池的电压都低于 V_{cov} , HM8247 退出过充电状态, 此时若无其他充电保护事件, 则打开充电 MOSFET。

5. 过放电保护

一旦任何一节电池电压低于 V_{cuv} 并持续 T_{cuv} 及以上, HM8247 就进入过放电保护状态 (CUV), 放电 MOSFET 关

闭, 同时打开充电器检测模块。

CUV 恢复:

- a) 所有电池电压被充电至 V_{cuvr} 及以上。
- b) 负载被移除或者充电器插入。

6. 休眠状态

在过放电状态, 如果同时满足以下条件, HM8247 将进入休眠状态:

- a) 无任何充电保护事件(过充电、充电过温、充电低温)。
- b) 过放电状态持续 T_{cuv_pd} 及以上。

在休眠状态, 放电 MOSFET 关闭, 充电 MOSFET 打开, 大部分内部电路停止工作, 消耗电流降低至 I_{vcc_pd} 或更低。

休眠状态恢复需要满足以下条件:

- a) 充电器插入。

7. 延迟时间设置

过充电保护延迟时间(T_{cov})和温度检测周期(T_{tdet})由连接到 COVT 引脚的外部电容设置。

过放电保护延迟时间(T_{cuv})、关断延迟时间(T_{cuv_pd})和一段/二段过电流延迟时间(T_{pdoc1} & T_{pdoc2})由连接到 CUVT 引脚的外部电容设置。

短路保护延迟(T_{psc})为固定的 250μS (典型值)。

典型值:

T_{cov}	$[s] = 10 * C_{covt} [\mu F]$
T_{tdet}	$[s] = 10 * C_{covt} [\mu F]$
T_{cuv}	$[s] = 10 * C_{cuvt} [\mu F]$
T_{cuv_pd}	$[s] = 110 * C_{cuvt} [\mu F]$
T_{pdoc1}	$[s] = 10 * C_{cuvt} [\mu F]$
T_{pdoc2}	$[s] = 1.0 * C_{cuvt} [\mu F]$

8. SEL1 和 SEL2 功能

SEL1 和 SEL2 用于设置电池串联数:

表 3. SEL1 和 SEL2 设置

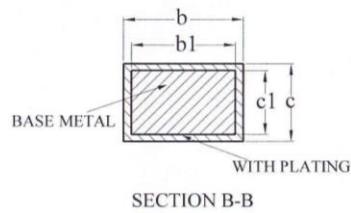
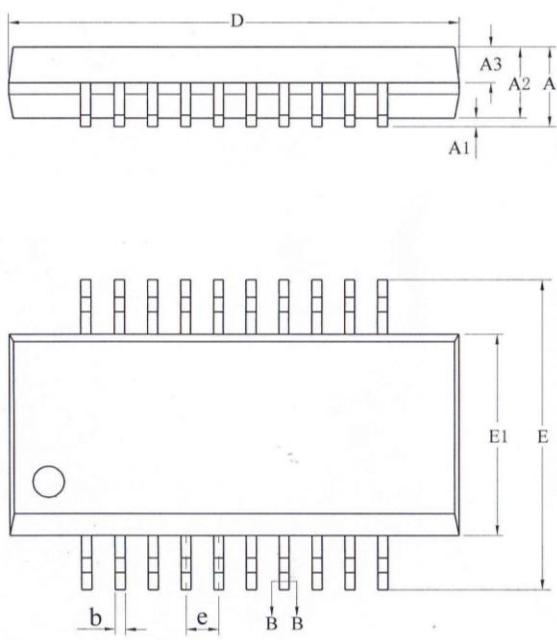
SEL2	SEL1	设置
VC7	VC7	7 串
VC7	VSS	6 串
VSS	VC7	5 串
VSS	VSS	4 串

产品名目录

Part Number	COV Threshold V_{COV}	COV release Threshold V_{COVR}	CUV Threshold V_{CUV}	CUV release Threshold V_{CUVR}	Pack Level-1 OC Threshold V_{PDOC1}	Pack Level-2 OC Threshold V_{DOCP2}	Pack SC Threshold V_{PSC}
HM8247-AAV	4.25 ±0.025V	4.05 ±0.025V	2.7 ±0.08V	3.0 ±0.08V	0.1 ±0.01V	0.2 ±0.02V	0.5 ±0.05V
HM8247-ABV	4.20 ±0.025V	4.00 ±0.025V	2.7 ±0.08V	3.0 ±0.08V	0.1 ±0.01V	0.2 ±0.02V	0.5 ±0.05V

注：需要上述检测电压值以外的产品时，请向本公司销售咨询。

封装信息



SYMBOL	MILLIMETER		
	MIN	NOM	MAX
A	—	—	1.75
A1	0.10	0.15	0.25
A2	1.30	1.40	1.50
A3	0.60	0.65	0.70
b	0.23	—	0.31
b1	0.22	0.25	0.28
c	0.20	—	0.24
c1	0.19	0.20	0.21
D	8.55	8.65	8.75
E	5.80	6.00	6.20
E1	3.80	3.90	4.00
e	0.635BSC		
h	0.30	—	0.50
L	0.50	—	0.80
L1	1.05REF		
theta	0	—	8°